

SuperLIX-R 非接触法激光热膨胀仪

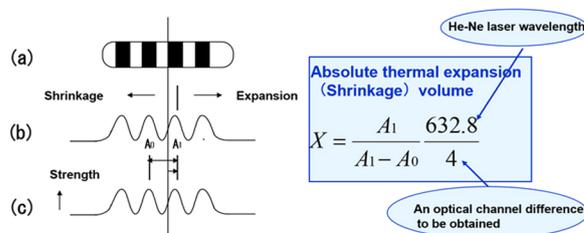


◆ 应用案例

- 零膨胀材料的研制
- 负极负热膨胀材料的研制
- 标准材料开发
- 致动器材料的开发

◆ 用途

- 10⁻⁹/K级极低膨胀系数材料（玻璃，陶瓷，金属等）的高精度热膨胀测量
- 半导体生产装置光学曝光元件的测量
- 测量精密载物台零件
- 航空航天相关高精度所需材料的测量
- 高精度光图基板构件的测量
- 低膨胀系数材料的质量控制
- 标准热膨胀仪校准样品的测量



双光路迈克尔逊激光干涉法

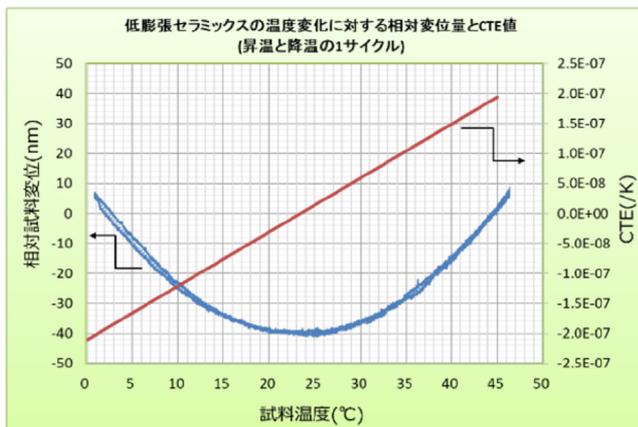
◆ 特点

- 通过在设备中包括振动消除机构，可以防止振动扰动的影响，并且可以在能够稳定使用普通电子天平（0.01毫克分辨率）进行分析的环境中进行测量。（日本专利：2016-058190、058191、058192）
- 测量样品相对于激光波长（632.8 nm）的位移量。集成光学元件可以消除杂散光，提高干涉条纹信号的信噪比。不需要特殊位移校准的测量和操作。
- 通过用图像传感器检测干涉条纹并对其进行图像处理，即使在样品测量过程中，也可以以高分辨率（1纳米）计算位移（膨胀/收缩）量，并确认膨胀系数。
- 符合JIS R3251-1990标准

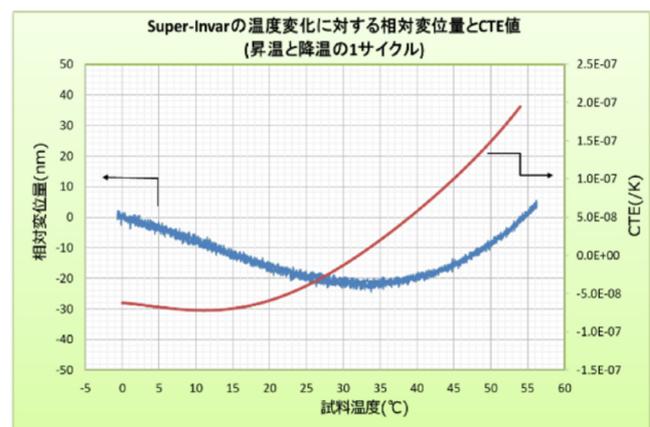
◆ 设备参数

型式	SuperLIX-R
温度范围	标准0-50°C（采用高精度恒温循环系统）
样品尺寸	φ5或角5±0.5 mm×12-20 mm长 (标准样品尺寸为5×20mmL，端面R加工为标准样品)
测量气氛	减压He气氛
测量方法	双光路迈克尔逊激光干涉系统

◆ 应用实例



低膨胀陶瓷的测量例子



金属（超级因瓦）的测量示例

更多详情，欢迎来电咨询；

凯戈纳斯仪器商贸（上海）有限公司

地址：上海市虹口区四平路775弄1号天宝华庭1115室

Tel: 021-5836 2582 传真: 021-5836 2581

网址: www.k-analys.se

ADVANCE RIKO, Inc.: advance-riko.com/en/